Search Notes		

Application/Control No	. Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/654,553	HAYASHI ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Drew E. Becker	1761	

SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
Search	plate	12-20-00	OF D
426	549		
	549 560 512 517)		
	3/23/		_
425	367		
		:	
	·		•

INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner
426	<b>\$ 502</b>	122006	JE3
•	504 517	D	1
	560		
425	367 373		
	·	•	

(INCLUDING SEAR	CHSIRALE	GY)
	DATE	EXMR
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
•		
•		
	•	
	.	1
	47	